



## 科研产出

- 论文 >
- 专利 >
- 专著 >

当前位置 > 首页 > 科研工作 > 科研产出 > 专利

专利名称:	高精度集成电路器件测试设备
专利类别:	发明专利
申请号:	201110203000.8
申请日期:	2011-07-20
专利号:	201110203000.8
第一发明人:	殷华湘;梁擎擎;钟汇才
实施情况:	授权
专利证书号:	201110203000.8
其它备注:	十室

